# 解説

# 表面黒化処理と太陽光選択吸収性

Metal Surface Blacking and Solar Selective Absorber

松 原 弘 美\* • 小坂 岑 雄\*\* Hiromi Matsubara Mineo Kosaka

# 1. まえがき

本稿は太陽光の選択的吸収による高効率集熱を目的 とする機能性コーティング(Solar Selective Absorber:以下SSAと略記)について扱っている.SSA機 能は太陽光の波長(一般に0.3~2.0 $\mu$ m)に対する高い 吸収率,  $\alpha$ , と赤外(熱)線の波長(>2.0 $\mu$ m)に対 する低い放射率,  $\epsilon$ , に要約される<sup>1)</sup>.SSAを得る手 段には表1のようなものがあり、それぞれに研究が進 められている<sup>2)</sup>.実際のSSAは表1の分類すべてが関 与するが、ここでは主に①について述べる.

吸収材/反射材タンデムとは、要するに、赤外線波長 で低い放射率を示す金属の表面に、太陽光波長で高い 吸収率を示す(黒色の)酸化物層が極く薄くコートさ れた状態(逆の配置もありうるが)である.このとき、 酸化物層は赤外線に対しては透明でなくてはならない.

また,太陽光の全波長域で高い吸収率を保持するに は,酸化物が半導性を有し,さらにその屈折率が外気 のn=1から,酸化物/金属の界面まで,スムーズに増 加して行くような構造であることが望ましい<sup>4-11)</sup>.酸 化物の表面や金属との界面の物理的な粗さも,当然な がら,SSA性能に大きく影響する.①タイプのSSA製 作には,CVDやスパッタリング法もあるが,多くの場 合に電解酸化,同共折・着色,化成など金属表面処理 の諸手法(一部では加熱酸化も)が用いられる.これ には,・大面積に適用可能で,・比較的に低コスト, ・再現性の確保が容易,等々がその背景となっている.

SSAは、<1µmほどの薄膜であるが、その内部には 構成成分の濃度分布、微細な金属粒や酸化物粒の折 出、界面の凹凸、空孔の分布、不純物、その他を含む、 非常に複雑な構造を有する.これらの構造は直接、SSA の性能に関することはもちろん、膜の耐熱性や耐久性

- 〒462 名古屋市北区平手町1-1
- \*\* 名古屋工業技術試験所金属部材料工学課長

表1 SSAを得る方法の分類

1	モモータイプ	一例と文献		
1	吸収体/反射体タンデム	各種金属ブラック	3)	
2	多量干涉層	A 12 03-Mo-A 12 03ほか	4)	
3	半導体粉末/反射材	Pbo粉末/アルミニウムなど	5)	
4	粗面	WやReのデンドライト利用	6)	
5	共鳴分散	金属粉/誘電体の分散系	7)	
6	屈折率の勾配	多重蒸着	8)	

\*実際にはこれらが複合してSSAを形成している.

にも大きな影響を及ぼすと考えられている.

近年,急進展を見せている微小部分の解析・分析の 手段,たとえばTEM (透過電顕),SEM (走査電顕), AES (オージェ電子分析),XPS (X線けい光分析), FIM (フィールド,イオン電顕),XRD (X線回析), RED (反射電子回析)などがSSA 膜に適用され,徐 々にではあるが,未知の膜構造にも新しい光があてら れつつある.以下では,SSAの製作条件と共に,上記 の知見を含めて解説する.

## 2. SSAの製法とその構造

#### 2.1 コバルト・ブラック

SSAの性能(要するに高いα値と低いε値を目標と する)はその製作条件に鋭敏に影響される.このため, たとえば電解酸化法では,浴組成,温度,電流密度, 時間,その他を高いSSA性能をうるために最適化する 必要があり,多くの努力が積み上げられてきた.コバ ルト・ブラックによるSSAには電解<sup>13,14)</sup>によるもの と,加熱酸化<sup>15)</sup>による製法が報告されている.代表的 な条件とそれによる成績を表2に示す.

Smithら<sup>16</sup>は加熱酸化によるSSA膜をAESやXP Sを用いて観察した。図-1はAES結果の一部である が,その濃度分布は参考図のクロム・ブラックほどは っきりしていない、XPSデータはCoO層の上にフレー ク状の酸化物が重なっており、Co濃度は表面から内部 へ増大することを示した。彼らはまた最外層が粗なCo (OH)2フレークからなることを示している。



<sup>\*</sup>名古屋工業技術試験所金属部材料工学課

基板	ニッケル
電解浴	CoSO4・7H2O:450g/L,ホウ酸:33 KC1:16
条件 <sup>350</sup> A/㎡, 8 min, 36℃ *得られた Coメッキを400℃で空気酸	
光学特性	$\alpha = 0.96, \ \epsilon \ge 0.4$
耐熱性テスト	450°C, 200h加熱後α=0.96, ε=0.4

表2 コバルト・ブラックSSAの一例<sup>16)</sup>







加熱酸化によるSSAはそれなりに耐熱性を有するが、基板への付着力が劣ると言われている<sup>17)</sup>.

# 2.2 銅ブラック

銅の酸化物はその半導性が期待されたが、加熱酸化 によるものはCuO/Cu<sub>2</sub>Oの二重層となり、  $\alpha = 0.5 \sim$ 0.7,  $\epsilon = 0.5$  と低い値しか得られなかった<sup>18,19)</sup>、電解 酸化や化成法について多くの研究がある。代表的なー 例を表3に示した<sup>20)</sup>、REDによる観察ではまず基板 上に平滑な Cu<sub>2</sub>O 層ができ、その上にフレーク状の CuO が形成されるようであった。ただしこのSSAを180℃。 8 hr熱処理すると $\alpha$ =0.89,  $\epsilon$ =0.1まで劣化した<sup>20</sup>) 膜をクロメート処理することで耐熱性の改善<sup>22)</sup>が図ら れた<sup>21)</sup>. 表とは異る浴<sup>23)</sup> からのSSA に XRDを適用し た結果<sup>24)</sup>は酸化物が主としてCu<sub>2</sub>Oであり、表面が非 常に薄いCuOからなることを示した。しかし Milgram<sup>25)</sup>は,その光学的性質(図-2)から膜の組成は主と してCuO<sup>20</sup>)であることを主張した。K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>-KNO<sub>3</sub> 系浴による膜のSEM観察<sup>26)</sup>によれば、多孔かつ針状 のCuOが表面に認められ、この針状物は基板上にエピ

表3 銅・ブラックSSAの一例<sup>20)</sup>

基	栃	Ŕ	鉰
化	成	浴	NaOH : 60g/L, K <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20
条		件	7.5 min, 60°C
光	学 特	性	$\alpha = 0.97, \epsilon \geq 0.17$
耐熱性テスト			160°C, 900h加熱後α=0.96, ε=0.10



タキシァル成長した酸化物の上に乗っているようであ った.酸化物が脆いためにTEMは使用できず,膜を イオン照射削除した後のREDでは基板のごく近傍で CuO→Cu<sub>2</sub>Oと変化することが示された<sup>43)</sup>.NaClO<sub>2</sub> 系浴からのSSAは比較的に厚く,密な構造であり,多 くCu<sub>2</sub>Oからなる<sup>22)</sup>.NaOH系浴(70℃)によるSSA は大部分CuOでその粒径は約25nm,ランダムで空孔 の多い集積であった.SSAに金を蒸着して表面構造が 調べられた<sup>27)</sup>.Milgram<sup>28)</sup>は銅ブラックの耐熱性の低 さが,銅基板の酸化によることを述べている.

2.3 ニッケル・ブラック(鉄ブラック)

ニッケル・ブラックがSSAとして報告されたのはか なり古い<sup>30-32)</sup>.その作製条件の一例を表4に示す<sup>34)</sup>. 表からわかるように、メッキされる吸収体はNi-Zn ーS系の複合体である.銅板上のニッケル・ブラック は、上記同様に基板の酸化によって耐熱性が劣る<sup>31)</sup>. Lin and Zimmer<sup>34)</sup>はこの膜にAES, REDを適用 した.その結果では膜の下層は金属Ni, Zn,およびそ れらの酸化物・硫化物の粒子からなり、表層は30nm以 下のNiまたはZn酸化物の極微粒子からなる.熱劣化 の原因を追求した研究<sup>33)</sup>によれば、劣化は最初膜中S の酸化によって起り、より高温になると基板の酸化が 加わる.

鉄ブラックも同様の浴から作製できる。 $Mar^{35}$ らに よれば最高でも $\alpha$ =0.85,  $\epsilon$  = 0.08であった。 $\alpha$ が低いの 1.0

ł	e i	扳	銅
電	解	浴	NaCNS : 8~12g/L, NiCI <sub>2</sub> : 80~100 NH <sub>4</sub> CI : 10~30, ZnCI <sub>2</sub> : 20~30
条		件	1.2~1.5 A/dm <sup>2</sup> , 0.6 3~0.7 min 20~30℃
光	学 特	性	$\alpha \ge 0.97$ , $\epsilon = 0.5$
耐熱性テスト		<	200°C, 200 h加熱後α=0.95, ε=0.25

表4 ニッケル・ブラックSSAの一例<sup>33)</sup>



図-3 ニッケル・ブラックの分光反射率

は鉄酸化物の屈折率 nが高すぎることによるらしい. SSA 表面を樹脂コートすると, nの低下により $\alpha$ =0.9,  $\epsilon$ =0.4となる.  $\epsilon$ が上昇するので, SSA 性能はあまり 向上しない. ニッケル・ブラック, 鉄ブラック共に, 高温・多湿の場所では劣化が心配される. 図-3にはニ ッケル・ブラックの分光反射率を示す.

2.4 クロム・ブラック

クロム・ブラックに関する研究<sup>36,56)</sup>はかなり多くな されている. 最良のSSA機能をうるため. 電解条件の 選定が統計手法を用いて行われた<sup>37,39)</sup>.それらの一例 を表5に示す。比較的短い時間と高い電流密度で好結 果が得られるようである。ただし銅基板上の膜は上記 と同様に熱劣化が大きい、クロム・ブラックの構造は その作製条件や基板の種類で大きく変化するようであ る<sup>73</sup>). AES<sup>41</sup>) や XPS<sup>42</sup>), TEM<sup>43</sup>) などを用いてその 微構造が調べられた. 基本組成はクロムと酸素である が、膜をイオンスパッタで削って行くと、深さ方向に 組成の変化が認められる。ただし、その空孔率が非常 に大であるために定量的情報は得にくいようだ44.45) その空孔率も深さ方向に変化する46)。いま金属クロム とCr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>しか存在しないと仮定すれば、Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cr+ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>比はおよそ 0.3 ~ 0.44 と考えられる<sup>47)</sup>.酸化 物は一般にCr2O3と考えうるが、Cr (OH)2の存在を 認める報告42)もあり、表面附近には微量ながらも CrH<sub>2</sub>, CrO<sub>3</sub>, CrO, Cr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, CrO<sub>3</sub>等が存在するとす る観察もある<sup>48)</sup>. SEM<sup>49)</sup>によるとクロム・ブラックの

表5 クロム・ブラックSSAの一例<sup>39,40)</sup>

基板			ニッケル
電	解浴	ş	CrO3 : 327~337g/L, サク酸バリウム他 添加物 : 25~26
条	倂	ŧ	150~190 A/cm², 3~5min, 15~20°C
光	学特性	E	$\alpha = 0.97$ , $\epsilon = 0.12$
耐熱性テスト			450℃, 8h加熱後α=0.94, ε=0.1

表面は50~100nmの球状折出物からなる.表層をスパ ッタ除去すると、円形の折出物となったが、他の研 究<sup>50)</sup>では確認できなかった.空孔の多さが厚みの決定 を困難とするが、一般には0.4~0.7µmと考えられて いる. as plate 膜のTED<sup>51)</sup>は広いハローを与えるた め、その酸化物は極微結晶あるいはアモルファスと考 えられた.上記球体中の濃度分布はわからないが、金 属Crと酸化状態のCrがあることはFIM<sup>52)</sup>からも知ら れる.熱処理をうけるとこれらの微結晶が粒成長する ようである.図-4には、Murrら<sup>41)</sup>による構造モデル を示す.

酸化物の付着量は~5.8×10<sup>-5</sup>g/cd程度であり、その平均充てん率は~33%と考えられる<sup>53,54)</sup>.

一方, Richieら<sup>55)</sup> は他と異なる針状の折出物を報 告した. クロム・ブラックについては種村<sup>56)</sup>の解説が ある.

2.5 着色アルマイト

アルミニウムの表面を、リン酸、硫酸、シュウ酸な どの浴中で陽極酸化して得られる「アルマイト」は工 業的にも重要な技術である<sup>56)、70~72)</sup>. SSAの作製に は多くリン酸系が用いられる<sup>57)</sup>. 電解条件はアルミナ 膜厚が0.4~0.7 $\mu$ mになるように調節される.次に多 孔質アルミナ皮膜のポア中に、金属(多くの場合にNi) 微粒子<sup>57,58)</sup>を折出させる. この場合の折出量は7~9 mg/d㎡が最適と考えられている. 硫化物を用いた例<sup>59)</sup> もあるが耐熱性はよくなかった.

Ni以外の金属についても研究<sup>60)</sup>されているが、Cu の劣化は早いようである、AES<sup>60)</sup>による濃度分布の試



図-4 クロム・ブラックに考えられた構造のモデル41)

141

基	板	アルミニウム		
	ATI	陽極酸化 H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> : 4~10w/v% および添加物		
電	产 化	後 着 色 金属を含む浴(例えば NiSO <sub>4</sub> : 60~120 g/L, H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> : 15~30)		
条	倂	陽極酸化 DC0.1~0.5 A/dn, 35v以下 (AC0.1~1.5 A/dn), 25~28℃ 腹厚を0.4~0.7μmに調整		
		後 着 色 金属量を7~9mg/dm		
光:	学特性	Ni折出でa=0.93, ε=0.1		
耐熱性テスト		350℃, 1000h加熱後α=0.92, ε=0.06		

表6 着色アルマイト SSA の一例<sup>57)</sup>



図-5 着色アルマイト SSA のモデル

験も行われているが、この技術はSSA以外にも装飾 用の多色着色法として実用されている。図-5には着色 アルマイトの構造モデル<sup>61)</sup>を示した。

2.6 亜鉛ブラック

NaOHまたは NaNO<sub>3</sub> 浴中での亜鉛の電解酸化の研 究に端を発して, SSA機能<sup>62,63)</sup> が見出された. 電解に は交流法<sup>64)</sup> や直流法<sup>65)</sup> が用いられ, 条件の選定が統 計手法を用いて試験されている. その一部を表7に示 した.

最良の条件では $\alpha$ >0.97,  $\epsilon$ =0.2程度<sup>68</sup>) となった. アルミニウム板上にメッキした亜鉛<sup>66)</sup>の電解酸化でも SSAが得られ,耐熱性<sup>67)</sup> も良好であった. 膜が亜鉛酸 化物の微粒子からなることが TEM や RED を用いて 調べられているが<sup>63)</sup>, AES<sup>64)</sup> による酸素の濃度分布

衣 /	亜鉛・	フラ	ック	SSAの	一例⁰⁴,⁰⁰	,
						_

基板	アルミ上にメッキした亜鉛
電解浴	NaOH : 12.8g/L, NaNO <sub>3</sub> : 15 NaCIO <sub>2</sub> : 0~10
条件	8A/dm², 1.5~2.0min, 33~42°C
光学特性	α≥0.98, ε=0.96,
耐熱性テスト	200°C, 200 h加熱後α=0.96, ε=0.12

は膜中で比較的に均一であった.金属 Zn と化合物 Zn の分離ははっきりしない.SEM<sup>68</sup>)によると酸化物層は 0.5~1µm厚で,その表面は比較的密に充てんした球 状の折出物であった.TEM は~100 nm の ZnO粒子を 示したが,その中に金属 Znが分散している証拠はつか めていない.膜をスパッタ削除しつつ RED 観察する と,微小な酸化物粒子が,界面で急に大きな Zn(基板 の)粒子に変わる.これらの観察から図-6のようなモ デルが提案されている.ここでは酸化物の物性<sup>69</sup>)より も,界面の物理的な粗さが強調されているようにみえ る.酸素欠陥を有する ZnO の物性解明がさらに必要と 考えられる.



図-6 亜鉛ブラックに考えられた構造のモデル68)

2.7 その他

有名なステンレス鋼の溶融塩化成<sup>79</sup> によるSSA や サーメット溶射<sup>80</sup> など、他にも多くの提案があるが割 愛させて頂いた。公開特許の中にも興味ある技術が数 多く示されている。

#### 3. あとがき

以上述べてきたように、SSAの内部構造は今もって 完全にはわかっていない。SSAの製作上は、要するに 高 $\alpha$ ,低 $\epsilon$ を実現すればよく、そのためには最適製作条 件の選定がまず肝要である。各種の近代的分析手段は そこに起っている現象の解明に役立つが、逆に最適の 製作条件を指定できるわけではない。膜が非常に薄く、 生成する微粒子はさらに小さいので、各種の測定法は その分解能限界に近くなっている。情報が定性的であ るのもやむを得まい。 $\alpha$ や $\epsilon$ 値による総括的なSSAの 評価を越えて、材料の本質の理解に貢献しつつある点 を勧迎したい。一方適当に簡略化されたモデルにより、 SSAの分光反射特性を計算により再現する努力<sup>73,74)</sup> が続けられており、ある程度の成功を納めている<sup>56,57)</sup>. しかし、反射特性と一致させる構造モデルは複数あ りうるので、Sweetら<sup>76)</sup>らは、クロム・ブラックの加

## Vol. 8 No. 2 (1987)

熱による特性変化を、そのような仮定に基いて説明した。計算に用いられる材料物性、たとえば誘電率の近 似的取扱いも厳密とは言えない。何よりも「簡単」な モデルと上記したいくつかの知見との間には大きすぎ る差があるようにも思われる<sup>77)</sup>。今後の進展に期待し たい。

エネルギー需給が見かけ上緩和している昨今では、 SSAの話題は少し色あせたものかも知れない.しかし 長期的にみて、太陽エネルギー資源の重要性は疑えない.

本稿をまとめるあたり, Inalらの総説<sup>78)</sup>を参照した ことを記して感謝する。また、本稿が読者の興味を引 き、何らかの御参考となることを祈念して終りとする。

## 参考文献

- 1) B. O. Seraphin ; AIP Conf., No.40(1978, N.Y.).
- 2)金属表面技術協会; "ソーラシステムと表面技術", 東京, (1982).
- 3) G. E. McDonald ; Solar Energy, 17, 117 (1975).
- 4) P. E. Peterson and J. Ramsey ; J. Vac. Sci. Tech., 12, 471(1975).
- 5) D. A. Williams et al.; Trans. ASME, J. Eng. Power, 85A, 218 (1963).
- 6) J. T. cuomo at al. ; Appl. Phys. Lett., 26(1975).
- 7) K. D. Masterson ; Soc. Photo-Opt. Inst. Eng., 68, 147(1975).
- G. Zerlaut ; "Critical Materials Problems in Energy Production", C. Stein ed., Acad. Press., N. Y., 1976, p. 899.
- 9) I. T. Ritchie and B. Window ; Appl. Opt., 16, 1438 (1977).
- R. B. Pettit and R. R. Sowell ; J. Vac. Sci. Tech., 13, 596 (1976).
- R. B. Buhrman and H. G. Craighead ; "Solar Materials Sci"., L. E. Murr ed., Acad, Press., N. Y., 1980, p. 294.
- 12) 日本金属学会会報, 25, No. 3, (1986), 記事
- 13) G. McDonald ; Thin Solid Films, 72, 83(1980).
- 14) L. D. Burke and O. J. Murphy ; Electroanal. Chem., 112, 379 (1980).
- 15) A. Scherer and O. T. Inal ; Thin Solid Films, 113, 112(1984).
- 16) G. B. Smith et al.; J. Appl. Phys., 51, 4186(1980).
- 17) P. Kokoropoulos et al.; Solar Energy, 3, 19(1959).
- 18) J. Bloem ; Philips Res. Rep., 13, 167 (1958).
- 19) D. L. Douglas and R. B. Pellit ; Solar Energy Mater., 4, 385(1981).
- 20) A. Scherer et al.; ibid, 9, 139 (1983).

- 21) C. Li and A. F. Reid ; CSIRO Rep., 1979, Australia.
- 22) A. Roos et al. ; Thin Solid Films, 90, 411 (1982).
- 23) A. A. Milgram ; J. Appl. Phys., 54, 3640(1983).
- 24) A. F. Reid and A. F. Wilson ; Solar Eng. Prog. Aust. N. Z., 23(1974).
- 25) A. A. Milgram ; J. Appl. Phys., 54, 1053(1983).
- 26) A. Scherer and O. T. Inal ; Thin Solid Films, 119, 413 (1984).
- 27) A. Scherer and O. T. Inal, ibid, 113, 112 (1984).
- 28) A. A. Milgram ; J. Appl. Phys., 54, 4692(1983).
- 29) D. K. Edwards et al.; Solar Energy Mater., 6 1 (1962).
- H. Tabor ; "Conf. Use of Solar Energy," Vol.2., p. 1A, Tucson, Arizoma. 1956.
- 31) J. Jurisson et al.; J. Vac. Sci. Tech., 12, 1010(1975).
- 32) R. E. Peterson and J. W. Ramsey, ibid, 12, 174 (1975).
- 33) S. N. Patel et al.; Solar Energy Mater., 11, 129 (1985).
- 34) R. J. H. Lin and R. B. Zimmer ; "Optimization of Coating for Solar Collectors", Phase II, Honeywell Inc. 1977, p. 85.
- 35) H. Y. B. Mar et al.; Thin Solid Films., 39, 95(1976).
- 36) G. McDonld; "A Survey of Coating for Solar Collectors", NASA, TMX-71830 (1974).
- 37) O. T. Inal et al.; Solar Energy Mater., 4, 333 (1981).
- 38) P. O. May et al.; ibid, 9, 253 (1983)
- 39) J. C. Mabon et al.; ibid, 7, 375 (1982).
- 40) R. B. Pettit et al.; ibid, 7, 153(1982).
- 41) L. M. Murretal.; Thin Solid Films, 72, 111 (1980).
- 42) G. Zajac et al.; J. Appl. Phys., 51, 5544(1980).
- 43) A. Scherer and O. T. Inal ; Thin Solid Films, 119, 413 (1984).
- 44) M. Valayaptre et al.; Solar Energy Mater, 2, 177 (1980).
- 45) P. O. May et al.; ibid, 9, 253 (1983).
- 46) G. Zajac and A. Ignatiev ; ibid, 2, 239 (1980).
- 47) P. H. Holloway et al.; Thin Solid Films. 72, 121(1980).
- 48) O. T. Richie et al.; Solar Energy Mater., 2, 167 (1980).
- 49) C. M. Lampert ; Thin Solid Films, 72, 73(1980).
- 50) A. Ignatiev et al.; Solar Energy Mater, 1, 69(1979).
- 51) C. M. Lampert et al. ; ibid, 1, 81(1979).
- 52) O. T. Inal et al.; Thin Solid Films., 83, 399 (1981).
- 53) J. N. Sweet and R. B. Pettit ; SAND-82-0964. SNL.
- 54) G. Zajac and A. Ignatiev ; Appl. Phys. Lett., 41, 435 (1982).
- 55) O. T. Richie et al.; Solar Energy Mater., 2, 167 (1980).
- 56) 種村; "表面技術総覧", 鵜飼他3名編, 広信社, 東京, 昭58, p. 431.
- 57) ref. 2), p.60 ref. 56), p.801.
- 58) A. Anderson et al.; J. Appl. Pys, 51, 754 (1980).

エネルギー・資源

- 59) A. Scherer and O. T. Inal ; Thin Solid Films, 101, 311 (1983).
- 60) 浅野ら,金表.57回講演大会予稿,156 (1978).
- 61) たとえば ref. 56), p.495.
- 62) M. A. Encheva ; J. Appl. Chem. USSR, 45, 318 (1972).
- 63) M. Van der Leij ; J. Electrochem. Soc., 125, 1361 (1978).
- 64) J. C. Mabon and O. T. Inal ; Thin Solid Films, 115, 51(1984).
- 65) P. O. May and O. T. Inal. ibid, in press.
- 66) SiN. Patel and O. T. Inal ; ibid, 113, 47(1984).
- 67) A. Scherer and O. T. Inal ; ibid, 113, 112 (1984); 119, 413 (1984).
- 68) C. Homuhal et al.; Solar Energy Mater., 4, 309 (1981).
- 69) K. I. Hagemark and P. E. Toren ; J. Electrochem. Soc., 122, 993 (1975).

- 70) L. W. Masters et al.; NBS-IR 81-22327.
- 71) K. Wada et al.; J. Appl. Electrochem., 9, 445 (1979).
- 72) A. Anderson et al.; J. Appl. Phys., 51, 754 (1980).
- 73) A. Ignatiev et al.; Appl. Phys. Lett., 34, 42(1979).
- 74) C. G. Granqvist and G. A. Niklassen ; J. Appl. Phys., 49, 3512(1978).
- 75) C. G. Granqvist ; Appl. Phys. Lett., 35, 268 (1979).
- 76) J. N. Sweet et al.; Solar Energy Mater, 10, 251 (1984).
- 77) R. W. Balluffi et al.; Mater. Sci. Eng., 53, 93(1983).
- 78) O. T. Inal and A. Scherer ; J. of Mater. Sci., 21, 729 (1986).
- 79) T. E. Evans et al.; Trans. Inst. Met. Finish., 51, 108 (1973).
- 80) J. M. Schreyer et al.; Corr. Abs., 20, 100 (1981).

お 知 ら せ

従来,報文は原則として,本研究会の研究発表会で発表されたものとする,という規定がござい ましたが,このたび検討の結果,その一文を削除し,報文は,全国各地の会員の方々より自由に投 稿して頂くことになりましたので,お知らせいたします.

その他原稿の種類では、\*見学記″は\*見聞記″に、\*会員の声″は\*談話室″に変更されました。 (奥付参照)